



中红外光的全谱测量方法和相应的装置

专利名称: 中红外光的全谱测量方法和相应的装置
专利类别: 发明
申请号: 2017111555680
第一发明人: 张佳
其它发明人: 朱江瑞;李刚;李运良
专利授权日期: 2020-11-10

[关闭窗口](#)

